National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
AIST

ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォーム
H２８年度　第2回地域セミナー

★参 加 無 料★
定 員 25 名

－ 概要 －

産総研では、国内の産業力強化と新産業創出の先導や社会イノベーションへの貢献を目指して先端計測分析技術の開発を実施しています。その一環として、独自に開発した先端計測や分析機器などを「**ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム**」の制度で公開しています。本セミナーでは、公開装置の概要と測定事例、また、公開機器の利用方法などを紹介します。

日時　平成２８年１１月１１日（金）13:３0～16:50
会場　JST東京本部 別館（K’s五番町）4階会議室F

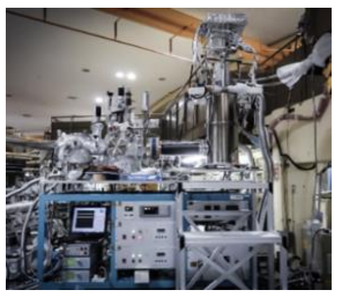
〒102-0076　東京都千代田区五番町７

■JR「市ヶ谷駅」より 徒歩3分
■都営新宿線、東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」（2番出口）より 徒歩3分

主催　国立研究開発法人 産業技術総合研究所
先端ナノ計測施設（ANCF)

共催　文部科学省
ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細構造解析プラットフォーム

共催　国立研究開発法人 科学技術振興機構
イノベーション拠点推進部



プログラム

13:30 – 13:50	挨拶・概要説明	分析計測標準研究部門　副研究部門長　齋藤 直昭
13:50 – 14:20	「陽電子プローブマイクロアナライザー装置」	分析計測標準研究部門　主任研究員　ORourke Brian
14:20 – 14:50	「超伝導蛍光収量Ｘ線吸収微細構造分析装置」	分析計測標準研究部門　研究主幹　松林 信行
14:50 – 15:20	「極端紫外光光電子分光装置」	ナノエレクトロニクス研究部門　テクニカルスタッフ　石塚 知明
15:20 – 15:30	休憩	
15:30 – 16:00	「リアル表面プローブ顕微鏡装置」	分析計測標準研究部門　主任研究員　井藤 浩志
16:00 – 16:30	「固体NMR装置」	物質計測標準研究部門　招聘研究員　林　繁信
16:30 – 16:50	「利用方法説明」	分析計測標準研究部門　研究主幹　松林 信行

◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人　産業技術総合研究所　分析計測標準研究部門
ANCF問合せ窓口：　ancf-info-ml@aist.go.jp
(当日の参加申し込みも可能です)

NanotechJapan Nanotechnology Platform

ANCF AIST Nanocharacterization Facility

国立研究開発法人　科学技術振興機構
Japan Science and Technology Agency

市ヶ谷駅から東京本部別館（K’s五番町）へのアクセス

■JR「市ヶ谷駅」より徒歩3分
■都営新宿線、東京メトロ南北線・有楽町線「市ヶ谷駅」（2番出口）より 徒歩3分

JSTのホームページ
https://www.jst.go.jp/koutsu_map2.html
より転載